

硅抛光片形貌测试，硅抛光片第三方检测机构

产品名称	硅抛光片形貌测试，硅抛光片第三方检测机构
公司名称	北京清析技术研究院
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间（住所）
联系电话	18855128475 18855128475

产品详情

硅抛光片检测标准

- 1、GB/T 19921-2005 硅抛光片表面颗粒测试方法
- 2、GB/T 6624-1995 硅抛光片表面质量目测检验方法
- 3、GB/T 6621-1995 硅抛光片表面平整度测试方法
- 4、GB/T 12964-2003 硅单晶抛光片
- 5、GB/T 4058-1995 硅抛光片氧化诱生缺陷的检验方法
- 6、GB/T 17169-1997 硅抛光片和外延片表面质量光反射测试方法

硅抛光片检测范围

单晶硅抛光片，半导体硅抛光片，硅单面抛光片，硅氧化抛光片，硅晶抛光片外延片，电子级硅抛光片，硅晶圆抛光片等。

硅抛光片检测项目

表面颗粒测试，显微组织测试，形貌测试，表面粗糙度测试，洁净包装测试，金属杂质测试，表面气体吸附测试，硬度测试等。

硅抛光片检测流程

- 1、沟通需求（在线或电话咨询）；
- 2、寄样（邮寄样品支持上门取样）；
- 3、初检（根据客户需求确定具体检测项目）；
- 4、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
- 5、签约（双方确定--签订保密协议）；
- 6、完成实验（出具检测报告，售后服务）；

以上是硅抛光片检测的相关介绍，如有其他检测需求可以咨询实验室工程师帮您解答。

清析技术研究院可提供相关检测服务，提供CMA/CNAS资质检测报告，致力于产品研发、成分分析、材料检测、工业诊断、模拟测试、大型仪器测试、可信性验证等技术服务，实验室设施完备、强大的项目专家检测团队。